NW2A/2012G077

アンジュレータ白色 X 線照射による Au イオンの還元 Reduction of Au ions in aqueous solution by irradiation of undulator white X-ray

中川貴^{1,*},清野智史¹,大久保雄司¹,久貝潤一郎¹,山本孝夫¹,仁谷浩明²,丹羽尉博² ¹大阪大学大学院工学研究科,〒565-0871 吹田市山田丘 2-1

2 放射光科学研究施設,〒305-0801 つくば市大穂 1-1

Takashi Nakagawa¹, Satoshi Seino¹, Yuji Ohkubo¹, Junichiro Kugai¹, Takao A. Yamamoto¹,

Hiroaki Nitani², Yasuhiro Niwa²

¹Graduate School of Engineering, Osaka Univ., 2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871, Japan ²Photon Factory, 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan

1 緒言

ナノ粒子の合成には数多くの方法が報告されてい るが、我々のグループは放射線(電子線、ガンマ 線)を貴金属イオン溶液に照射し、炭素材や酸化物 などの担体上に貴金属ナノ粒子を析出させ、医療・ バイオ分野や触媒に応用する研究に取り組んでいる ^[1, 2]。しかし、担体を分散させた溶液中での放射線 照射による貴金属イオン還元過程はよくわかってい ない。この還元過程を追跡するために、NW2Aの強 力な白色 X 線を利用して、金イオンを還元しつつ、 Au-L_{III}端の DXAFS 測定を行った。

2 <u>実験</u>

ビームラインは PF-AR の NW2A を使用した。ア ンジュレータの GAP 長は 32 mm で、ポリクロメー タは Au-L_{III}端の DXAFS 測定ができるよう調整した。 HAuCl₄を濃度が 80 mM となるように氷結脱気した 純水に溶解し、窓にカプトン膜を用いた透過長が 6 mm のアクリル製の溶液セルに入れた。図1に示 すように、溶液セルを白色X線が当たるポジション に配置し、溶液を撹拌しながら放射光を照射した。 担体効果を検証するために、カーボン粒子を添加し なかった場合と疎水性のカーボン粒子を添加した場 合、親水化処理したカーボン粒子を加えた場合の3 条件で比較実験を行った。また、カーボン粒子を添 加しなかった溶液については、GAP 長 24 mm での 実験も行った。表1に実験条件の詳細を示す。



3 結果と考察

行った4通りのいずれの実験でも、いずれも Au イオンはメタルへ還元された。しかし、条件により Au メタルが析出する場所が異なることがわかった。 表2に各実験における Au メタルの析出状況をまと める。溶液中にカーボン粒子がない場合は、GAP 長 が 24 mm でも 32 mm でも、図 2 に示すように窓材 のカプトンのX線が当たっているところのみに線状 に Au メタルが堆積した。疎水性のカーボン粒子を 分散させた場合は、図3に示すようにカプトンへの 堆積は観測されず、カーボン粒子表面に Au メタル が析出することがわかった。一方で、親水化したカ ーボン粒子を分散させたときは、図4に示すように、 カプトン窓も含めセル表面全体にめっきされるよう に Au メタルが析出した。これらのことから、還元 反応は固体表面が親水性か疎水性かとは無関係に、 X線の当たっている固液界面で起こり、還元された 金は疎水性の固体表面に析出していくことがわかっ た。



図2カーボン粒子無しの HAuCl₄水溶液に、GAP 長 24 mm で白色 X 線を 24 分照射した後のカプトン窓の写真。X 線 のあたったところに線状に Au メタルが堆積していること がわかる。



図 3 疎水性カーボンを分散させた HAuCl4 水溶液に GAP 長 32 mm で白色 X 線を 22 分照射した後のカプトン窓の写 真。カーボン粒子は着いているが、X 線のあたっていた ところへの Au メタルの析出は見られない。

| 云·1 八砍木口 | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|-----------|------------|-------------|------------|--|--|
| 実験番号 | Auイオン濃度 | 溶液量 | GAP 長(mm) | ビーム照射幅(mm) | 分散担体 | 照射時間(min.) | | |
| 1 | | | 24 | 25 | <i>t</i> >1 | 24 | | |
| 2 | 80 mM | 1.6 mL | 32 | 23 | ふし | 20 | | |
| 3 | | | | 10 | 疎水性カーボン | 22 | | |
| 4 | | | | 10 | 親水化カーボン | 10 | | |

表1 実験条件

表2 各実験での Au の析出場所

| 宝融采早 | カプトン窓へ | アクリルセル | 担体への |
|------|----------|-----------|--------|
| 天峽留方 | の Au の析出 | への Au の析出 | Au の析出 |
| 1 | あり | なし | _ |
| 2 | あり | なし | _ |
| 3 | なし | なし | あり |
| (4) | あり | あり | 不明 |



図 4 親水化カーボン粒子を分散させた HAuCl₄水溶液に GAP 長 32 mm で白色 X 線を 10 分照射した後のカプトン 窓(上)およびアクリルセルの写真(下)。X 線の当た っていない部位も金めっきされたような状態になってい る。

カーボン粒子を添加しない場合や、親水性のカー ボン粒子を添加した場合は、カプトン窓に Au メタ ルが析出していき、X 線のパス上に Au の濃度分布 が生じてしまうため、解析不能な XAFS スペクトル しか得られなかったが、疎水性カーボン粒子を分散 させた系では、非常に良好な XANES スペクトルを 観測することができた。図5に疎水性のカーボン粒 子を加えた場合の放射光照射中の Au-Lui 端の XANES スペクトルの変化を示す。白色 X 線の照射 とともに HAuCl₄が Au メタルに還元されていくこと がわかる。図6にはHAuCl4(0分のスペクトル)と Au foil のスペクトルの線形結合フィッティングから 求めた比率を示す。22 分後には Au イオンはほぼす べて金属に還元されていることがわかる。したがっ て、照射条件を整えると白色 X線の照射でイオンを 還元し、その過程を DXAFS 測定が追跡できること が明らかとなった。



図 5 疎水性カーボン粒子を分散させた HAuCl₄ 溶液に GAP 長 32 mm で白色 X 線を照射したときの Au-L_{III} 端の XANES スペクトルの時間変化



図 6 疎水性カーボン粒子を分散させた HAuCl₄ 溶液に GAP 長 32 mm で白色 X 線を照射したときの溶液中の HAuCl₄ と Au メタルの割合の時間変化。

- 4 <u>まとめ</u>
 - 本研究より以下のことが明らかになった。
- 白色 X 線で Au イオンを金属に還元できた。
- DXAFS 測定から、還元過程でのイオンと金属の割合を評価できた。
- Au イオンは X 線のあたっている固液界面で還 元し、疎水性表面に析出することがわかった。

参考文献

Satoshi Seino *et al.*, *J. Magn. Magn. Mater.* 293 (2005) 144-150.
Satoru Kageyama *et al.*, *J. Nanopart. Res.* 13 (2011) 5275–5287.

* nakagawa@mit.eng.osaka-u.ac.jp